

مشخصه‌یابی گرافین بر روی زیرلایه کوارتز به روش طیف‌سنجی تراهرتز

علیرضا دولت‌آبادی^۱، مهدی باحقیقت^۲، محمد کی^۳ و نصرتا... گرانپایه^{۱*}

^۱دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران، ^۲دانشگاه رجا-قزوین، ^۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

*نویسنده مسئول: granpayeh@kntu.ac.ir

چکیده-در این مقاله، نتایج حاصل از اندازه‌گیری پارامترهای مشخصه مختلف تک‌لایه گرافین بر زیرلایه کوارتز ارائه می‌شود. این نتایج بر اساس اندازه‌گیری به روش طیف سنجی تراهرتز به‌دست آمده‌اند. نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی به کمک برازش بر پارامترهای مدل درود برای رسانایی گرافین، به دست آمده‌اند.

کلید واژه- مشخصه‌یابی گرافین، طیف‌سنجی تراهرتز، گرافین، مدل درود.

Characterization of Graphene over the Quartz Substrate Using Terahertz Spectroscopy

Alireza Dolatabady^{1,2}, Mahdi Bahaghighat², Mohammad Kei³, and Nosrat Granpayeh^{1*}

¹K.N. Toosi University of Technology, ²Raja University of Qazvin, ³Islamic Azad University Central Tehran Branch, *Corresponding Author

Abstract-In this paper the results of analysis of a graphene layer over the quartz substrate is investigated based on terahertz spectroscopy. The characteristic parameters are deduced by fitting the experimental data into the Drude model for graphene conductivity.

Keywords: Graphene characterization, Drude model, Graphene, Terahertz spectroscopy.

۱- مقدمه

$$\sigma_g = \frac{ie^2\mu_c}{\pi\hbar^2(\omega + i\tau^{-1})} \quad (1)$$

که در آن e ، $\hbar$ و ω ، به ترتیب بار الکترون، ثابت پلانک کاهش یافته، و فرکانس زاویه‌ای هستند. τ و μ_c نیز به ترتیب زمان استراحت حامل‌های بار و پتانسیل شیمیایی هستند که باید برای هر لایه گرافین محاسبه شوند. برای محاسبه دو پارامتر τ و μ_c در این مقاله، از مطالعه میدان دور و روش طیف‌سنجی تراهرتز استفاده می‌کنیم. در ادامه این بخش، تئوری حاکم بر استنتاج پارامترهای زمان استراحت و پتانسیل شیمیایی به کمک این روش و نیز مبانی طیف‌سنجی تراهرتز معرفی می‌شوند.

۲-۱ تحلیل ساختار تک‌لایه شامل گرافین

اندازه‌گیری ویژگی‌های نوری مواد مانند عبور و بازتاب موج، ابزاری برای مطالعه ویژگی‌های الکترونیک آنها را فراهم می‌آورد. محیطی را در نظر بگیرید که در حالت کلی دارای تلفات است، و بنابراین دارای ضریب‌های گذردهی $(\tilde{\epsilon}_r)$ ، شکست (n) ، و رسانایی $(\tilde{\sigma})$ مختلط است. با در نظر گرفتن تابش یک موج صفحه‌ای به محیطی سه لایه مانند شکل ۱، ضریب عبور مختلط موج به صورت زیر تعریف می‌شود [۷]:

$$\tilde{T}(f) = \frac{1 + i\beta\sqrt{\tilde{\epsilon}_r}}{1 + i\beta \frac{(1 - \sqrt{\tilde{\epsilon}_r})(\sqrt{\tilde{\epsilon}_r} - \sqrt{\tilde{\epsilon}_{sub}})}{1 + \tilde{\epsilon}_{sub}}} \quad (2)$$

که در آن β ثابت انتشار است. برای حالتی که لایه میانی، ماده‌ای دوبعدی با ضخامت بسیار ناچیز باشد، رابطه (۲) به صورت زیر خواهد بود [۸]:

$$\tilde{T}(f) = \frac{n_{sub} + 1}{n_{sub} + 1 + Z_0\tilde{\sigma}(f)} \quad (3)$$

که در آن n_{sub} ، ضریب شکست زیرلایه و Z_0 امپدانس فضای آزاد برابر با ۳۷۷ اهم است. با حل رابطه (۳)، مقدار رسانایی به عنوان تابعی از فرکانس به دست خواهد آمد:

$$\tilde{\sigma}(f) = \frac{(1 - \tilde{T})(n_{sub} + 1)}{\tilde{T}Z_0} \quad (4)$$

در این مطالعات از زیرلایه بلور کوارتز (SiO_2) استفاده شده است که در فرکانس‌های تراهرتز فاقد پاشندگی است. بنابراین مقدار n_{sub} برابر با ۲/۱ است [۹].

گرافین، ساختاری تک لایه از اتم‌های کربن که در آرایشی شش ضلعی در کنار هم قرار گرفته‌اند، به عنوان نخستین ماده کشف شده دوبعدی به شمار می‌آید. با توجه به ویژگی‌های جالب و قابل توجه مکانیکی، شیمیایی، گرمایی، الکتریکی و نوری قابل تحقق توسط این ماده، توجه بسیاری از پژوهش‌گران به این ماده جلب شده است. تمرکز بسیار بالای میدان‌های در حال انتشار بر لایه گرافین، امکان ایجاد ادوات بسیار فشرده، در ابعادی کمتر از طول موج و حد پراش نور را فراهم نموده است [۱-۳].

برای مطالعه رفتار گرافین در مسائل مختلف الکترومغناطیس، از مدل رسانایی آن استفاده می‌شود. این مدل در فرکانس‌های تراهرتز، که طیف فرکانسی مورد نظر در این مطالعه است، به دو پارامتر انرژی شیمیایی و زمان استراحت حامل‌ها وابسته است [۴]. بنابراین برای مشخص بودن رسانایی گرافین، آگاهی از مقدار این پارامترها ضروری است.

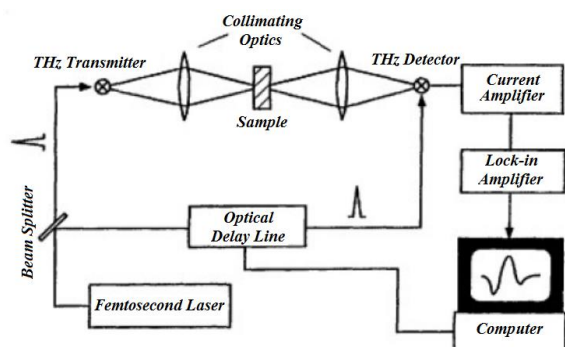
پارامتر رسانایی، نشان‌دهنده میزان هدایت الکتریکی یک ماده است. یکی از روش‌ها برای مطالعه این ویژگی، روش بررسی چهار نقطه‌ای است که از اتصالات فلزی برای اندازه‌گیری رسانایی بهره می‌برد [۵]. این روش، علاوه بر امکان تشکیل اتصال اهمی با ماده و بنابراین تغییر مقدار رسانایی، در کاربردهایی مثل تک‌لایه گرافین باعث آسیب به ماده شده و به عنوان یک راه‌کار غیرکاربردی در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله، به روش طیف‌سنجی تراهرتز، به مطالعه رفتار گرافین بر یک زیرلایه کوارتز و رسانایی الکتریکی آن پرداخته و با استفاده از برازش منحنی طیفی آن، دو پارامتر پتانسیل شیمیایی و زمان استراحت حامل‌های بار را استنتاج می‌نماییم.

ساختار مقاله به این صورت است که: در بخش دوم مبانی تحلیلی روش مطالعه ارائه می‌شود. در بخش سوم، چیدمان و نتایج آزمایش مطرح می‌شوند. در بخش چهارم نیز با بیان نتیجه‌گیری، مقاله خاتمه می‌یابد.

۲- مبانی تحلیلی روش مطالعه

برای معرفی گرافین در فرکانس‌های تراهرتز از مدل شبه درود به صورت زیر برای معرف رسانایی آن استفاده می‌شود [۶]:

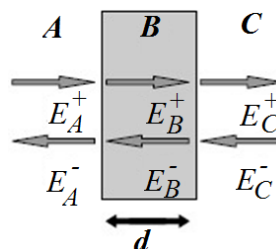
هستند که وظیفه آنها تولید و آشکارسازی تراهرتز است. مقسم پرتو، خط تاخیر نوری، تقویت کننده جریان، تقویت کننده قفل، دو عدسی، و یک پردازنده برای ذخیره سازی و تحلیل نتایج، دیگر اجزای تشکیل دهنده چیدمان آزمایش بر میز اپتیکی به کار برده شده هستند.



شکل ۲-نمایی شماتیک از چیدمان یک طیف سنج تراهرتز، که شرح عملکرد آن در متن داده شده است [۸].

نمونه مورد بررسی، تک لایه گرافین تولید شده به روش لایه نشانی بخار شیمیایی، بر ورقه مسی است که سپس بر زیرلایه کوارتز منتقل شده است. برای اطمینان از اینکه ساختار تنها شامل یک لایه گرافین است، از روش طیف-سنجی رامان استفاده می شود. در این روش، پرتو لیزر به نمونه تابیده می شود و سپس موج پراکنده شده جمع آوری و شدت آن در طول موج تابش اندازه گیری می شود. شدت امواج پراکنده شده نسبت به شدت نور تابیده شده، اطلاعاتی راجع به ساختار نمونه فراهم می آورد. طیف رامان نمونه مورد بررسی در شکل ۳ نشان داده می شود که محور افقی، عدد موج نور تابیده را بر حسب cm^{-1} ($1 = 33.33 \text{ cm}^{-1}$)، و محور عمودی شدت نور پراکنده شده را نشان می دهد. دو اوج مشخص، با نام های "G" و "2D" در شکل مشاهده می شوند که از ویژگی های یک تک لایه گرافین خالص و بدون نقص است [۱۰].

در شکل های ۴ و ۵، منحنی زمانی دامنه برای شکل موج میدان الکتریکی عبوری و نیز شدت طیف متناظر آن، به ترتیب برگرفته از آزمایش به روش طیف سنجی تراهرتز و اعمال تبدیل فوریه بر آن، نشان داده می شود. در این دو شکل، منحنی های قرمز رنگ برای ساختار زیرلایه تنها بدون لایه گرافین و منحنی های آبی برای ساختار شامل لایه گرافین است. منحنی های آبی رنگ نسبت به منحنی های قرمز رنگ شدت کمتری را نشان می دهند که ناشی از تلفات لایه گرافین، و یا به عبارتی بخش موهومی ضریب



شکل ۱-محیطی سه لایه برای استنتاج رابطه عبور موج، ضمن تابش موج صفحه ای [۷].

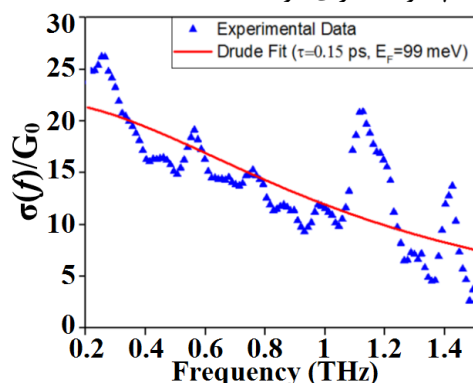
۲-۲- طیف سنجی تراهرتز

طیف سنجی تراهرتز، روشی است که در آن ویژگی های دی الکتریک یک نمونه، در یک آرایش عبور موج، تعیین می شود. برای استخراج اطلاعات طیفی، اندازه گیری دو میزان عبور لازم است که برای زیرلایه عاری از گرافین (به عنوان نرخ عبور مرجع) و بار دیگر زیرلایه شامل گرافین، صورت می گیرد. شکل ۲، نمایی از چیدمان طیف سنجی تراهرتز را نشان می دهد. یک لیزر فمتوثانیه، قطار پالسی را تحویل می دهد که توسط یک مقسم پرتو، به دو بخش تبدیل می شود. استفاده از این مقسم پرتو، رابطه زمانی مشخصی بین آشکارسازی پمپ و پالس تولید شده ایجاد می کند. یکی از این پرتوها به سوی یک آنتن فوتوکنداکتیو هدایت می شود که پالس لیزر را به یک پالس تراهرتز تبدیل کرده و مانند یک امپتر عمل می کند. یک عدسی موازی کننده پالس تراهرتز را هدایت و بر نمونه متمرکز می کند. حامل های بار در نمونه با موج تراهرتز اندرکنش کرده و شکل آنرا تغییر می دهند. پالس تراهرتز عبوری، از میان عدسی دوم عبور کرده که آنرا بر گیرنده، که آنتن فوتوکنداکتیو دوم است، متمرکز می نماید. پرتو لیزر دوم از مقسم پرتو نیز، از یک خط تاخیر نوری عبور می کند. فاصله عبور این پرتو به گونه ای تنظیم شده و در نهایت این پرتو به سوی گیرنده هدایت می شود. از این پرتو لیزر به همراهی با آنتن فوتوکنداکتیو برای اندازه گیری پالس تراهرتز عبور یافته استفاده می شود. همچنین یک تقویت کننده جریان برای تقویت سیگنال دریافتی از آشکارساز، و نیز یک تقویت کننده قفل برای تمایز سیگنال دریافتی از نویز زمینه، به کار گرفته می شوند [۸].

۳- چیدمان آزمایش و نتایج آن

چیدمان آزمایش در شکل ۲ نشان داده می شود. تجهیزات به کار رفته، علاوه بر یک لیزر فیبری، دو آنتن فوتوکنداکتیو

برازش منحنی تجربی یافته شده بر مدل درود در بازه فرکانسی ۰/۲ تا ۱/۵ تراهرتز، مقادیر ۹۹ میلی‌الکترون-ولت و ۰/۱۵ پیکو ثانیه برای دو مشخصه یادشده به‌دست آمد.



شکل ۶- طیف رسانایی به‌هنگار شده ساختار مورد بررسی، به کمک داده‌های حاصل از طیف‌سنجی تراهرتز و رابطه (۴) (آبی رنگ) و برازش آنها با روش حداقل مربعات بر مدل درود از رابطه (۱) (قرمز رنگ).

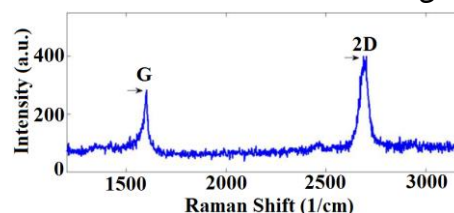
قدردانی

نویسنده اول از همکاران آزمایشگاه تراهرتز دانشگاه صنعتی آیندهون هلند آقایان استان ترهون، نیلز فن هوف، آلکسی هالپین، و مدیر محترم گروه نانوفوتونیک آقای کایمه گومز ریواس برای بحث‌های سازنده در مورد نحوه استفاده از تجهیزات و همکاری در اندازه‌گیری‌ها قدردانی می‌نماید.

مرجع‌ها

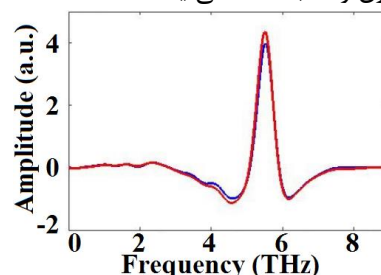
- [1] A. Dolatabady and N. Granpayeh, "Plasmonic magnetic sensor in graphene mounted on a magneto-optic grating," IEEE Trans. Magnet. to be published, 2017.
- [2] A. Dolatabady, S. Asgari, and N. Granpayeh, "Farinfrared nanoscale graphene based refractive index sensor," IEEE Sens. J. Vol. 18, pp. 569-574, 2018.
- [3] S. Asgari, A. Dolatabady and N. Granpayeh, "Tunable midinfrared wavelength selective structures based on resonator with antisymmetric parallel graphene pair," Opt. Engin. Vol. 56, pp. 067102 (1-6), 2017.
- [4] G.W. Hanson, "Dyadic Green's functions and guided surface waves for a surface conductivity model of graphene," J. Appl. Phys. Vol. 103, pp. 064302 (1-8), 2008.
- [5] C.L. Petersen, T.M. Hansen, P. Boggild, A. Boisen, O. Hansen, T. Hassenkam, and F. Grey, "Scanning microscopic four-point conductivity probes," Sens. Actuators A: Phys. Vol. 96, pp. 53-58, 2002.
- [6] H.J. Li, L.L. Wang, B. Sun, Z.R. Huang, and X. Zhai, "Controlling mid-infrared surface plasmon polaritons in the parallel graphene air," Appl. Phys. Express, Vol. 7, pp. 125101 (1-4), 2014.
- [7] S.A. Furman and A.V. Tikhonravov, *Basics of Optics of Multilayer Systems*, Frontiers, 1996.
- [8] M.C. Nuss and J. Orenstein, *Millimeter and Submillimeter Wave Spectroscopy of Solids*, Springer, 1998.
- [9] L. Gao, F. Lemarchand, and M. Lequime, "Exploitation of multiple incidences spectrometric measurements for thin film reverse engineering," Opt. Express, Vol. 20, pp. 15734-15751, 2012.
- [10] A.C. Ferrari and D.M. Basko, "Raman spectroscopy as a versatile tool for studying the properties of graphene," Nat. Nanotechnol. Vol. 8, pp. 235-246, 2013.

شکست آن است.

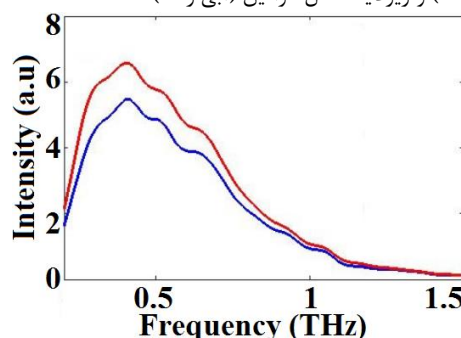


شکل ۳- طیف رامان ساختار مورد بررسی شامل تک‌لایه گرافین.

شکل ۶، طیف رسانایی به‌هنگار شده نسبت به $G_0 = 2e^2/h$ را نشان می‌دهد. منحنی آبی رنگ، نقاط داده اندازه‌گیری شده رسانایی را به کمک رابطه (۴) و منحنی قرمز، برازش این داده‌ها را به روش حداقل مربعات با مدل درود از رابطه (۱) نشان می‌دهد. ضریب عبور موج ($\tilde{T}$) از توان دوم نسبت دو شدت طیف آبی و قرمز رنگ شکل ۵ محاسبه شده است. مطابق این برازش، پارامترهای پیدا شده برای زمان استراحت و پتانسیل شیمیایی برابر با ۰/۱۵ پیکو ثانیه و ۹۹ میلی‌الکترون ولت به‌دست می‌آیند.



شکل ۴- شدت میدان زمانی پالس تراهرتز عبور یافته از زیرلایه تنها (قرمز رنگ) و زیرلایه شامل گرافین (آبی رنگ).



شکل ۵- طیف شدت موج عبور یافته از زیرلایه تنها (قرمز رنگ) و زیرلایه شامل گرافین (آبی رنگ).

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله، با به‌کار بردن روش طیف‌سنجی تراهرتز برای یک تک لایه گرافین بر زیرلایه کوارتز، به مطالعه پارامتر رسانایی آن برای استنتاج دو مشخصه مهم پتانسیل شیمیایی و زمان استراحت حامل‌های بار پرداخته شد. با